

「次世代電子顕微鏡法」社会連携講座

第2回 電子顕微鏡セミナー ～TEM 入門コース～

基本理論の解説から装置の操作に関するやや発展的な内容まで
電子顕微鏡初学者を対象としたセミナーです。

日時：2024年 **10月8日** (火) **13:00～18:00** (受付 12:30～)

開催形式：対面

定員：150名 (事前登録制先着順)

会場：武田先端知ビル5F

参加費：無料

お申し込み：下記 URL もしくは QR コードよりお申込みください

<https://forms.gle/yDeLJyBKPaKw8ahU6>



● お問い合わせ：東京大学・日本電子産学連携室 金子・斎藤 E-mail: skaneko@jeol.co.jp

プログラム

13:00～13:05	開会挨拶、オリエンテーション	東京大学大学院工学系研究科 石川 亮
13:05～14:05	TEMの基礎理論について	日本電子株式会社 近藤 行人
14:05～14:35	TEMのハードウェアについて	日本電子株式会社 EM事業U 山本 若葉
14:35～14:45	休憩	
14:45～15:15	TEM サンプルングについて (TEM サンプルング概略、イオンリング法)	日本電子株式会社 EP事業U 河原 尚
15:15～15:45	FIBによるTEM サンプルングについて	日本電子株式会社 EP事業U 柴田 昌照
15:45～16:15	様々なTEM観察手法の紹介	東京大学・日本電子産学連携室 斎藤 光浩
16:15～16:20	閉会挨拶	
16:20～18:00	意見交換会 (懇親会)	

主催：東京大学・次世代電子顕微鏡法社会連携講座

共催：東京大学・日本電子産学連携室、マテリアル先端リサーチインフラ事業 (ARIM)



東京大学
次世代電子顕微鏡法
社会連携講座



東京大学・日本電子産学連携室

The University of Tokyo - JEOL
University-Corporate Collaboration Office

